

走査型プローブ顕微鏡を利用したナノ材料・デバイスの先端計測技術

主催: 日本顕微鏡学会 走査プローブ顕微鏡分科会

日時: 9月7日(水) 10:00~17:20 (受付:9:30~)

場所: 幕張メッセ国際会議場2階 201A 会議室

参加費: 参加費(予稿集[カラー印刷のテキスト]代を含む) 3500円(学生500円)

事前登録: h.itoh@aist.go.jp 宛(又は Fax 029-861-5301)に氏名・所属・電話・FAX を記載して、件名に”JASIS

SPM 申込”と記載し、8月25日(木)までに E-Mail(又は FAX)で申込み下さい。

(当日参加や8月25日以降の申し込みの場合、予稿集が事後発送になる場合がございます。)

問合先: 氏名(所属) 井藤浩志(産業技術総合研究所) Tel:029-861-5752 E-mail:h.itoh@aist.go.jp

URL: 日本顕微鏡学会 <http://www.microscopy.or.jp/meeting/index.html>

走査型プローブ顕微鏡分科会 <http://www.nims.go.jp/project/amcp/spm/event.html>

実材料・デバイス分析のための、最先端の走査型プローブ顕微鏡(SPM)の研究と、SPMを利用するための基本技術の解説を行うことを目的としたセミナーです。電気測定をはじめとした、ナノスケールでの材料・デバイスの物性測定、および、より使いやすくするための技術(高速化、自動化等)、取り上げます。SPMメーカーからの最新の製品紹介も行われ、講師やメーカーの方と技術相談・機器導入相談も歓迎します。

時間	タイトル	講演者(所属)
10:00-10:15	開会あいさつ	井藤 浩志 (産業技術総合研究所)
10:05-10:50	非線形誘電率顕微鏡(SNDM)の原理とデバイス計測への応用	長 康夫(東北大学)
10:50-11:35	SNDMおよびSPM電磁気物性観察とSEM観察の融合	山岡 武博(日立ハイテクサイエンス)
11:35-12:10	製品紹介①島津製作所、②オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社、③東陽テクニカ、④日立ハイテクサイエンス、⑤生体分子計測研究所、⑥ブルカー・エイエックスエス ①~③は8分、④~⑥は5分	
12:10-14:10	休憩 (JASIS展をご覧ください)	
14:10-14:55	EFM/KPFMによる有機薄膜トランジスタの局所電子物性評価	小林 圭(京都大学)
14:55-15:40	マイクロ波インピーダンス顕微鏡(PeakForce sMIM)および高速AFMの原理と応用	三井 圭太(ブルカー・エイエックスエス)
15:40-15:50	休憩	
15:55-16:45	高速AFMの仕組みと溶液中動的観察への応用	小谷 則遠(生体分子計測研究所)
16:45-17:15	高速AFMを利用したレジストの現像過程の解析	ジュリウス・サンティリヤン (EIDEC)
17:15-17:20	閉会あいさつ	藤田 大介 (物質材料研究機構)